DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 07153219 A

Page 1 of 2

PAT-NO:

JP407153219A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 07153219 A

TITLE:

INSPECTION DEVICE OF FLEXIBLE DISK

PUBN-DATE:

June 16, 1995

# INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

IKEDA, YOSHIYUKI

# ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MITSUBISHI CHEM CORP N/A

**APPL-NO:** JP05329673

APPL-DATE: November 30, 1993

INT-CL (IPC): G11B023/00 , G11B005/00 , G11B020/18

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain high processing efficiency by arranging  $\underline{\text{disk}}$  devices in parallel, each of which operates independently, making them movable in the arrangement direction and getting a loading/ejecting mechanism to work sufficiently.

CONSTITUTION: A cam driver 3 is turned counterclockwise when the operation is started, and a pressing out plate 21 is projected to a hopper 2, thereby the disk W on the lowermost level is forwarded. A tip of the disk W is inserted to the device 5 by a roller 15. The driver 3 is turned further and a lever 41 is pushed up by a pin 31 to completely load the disk W. Specified tests are made independently on each device 5 to which the loading is completed. When a signal of the test completion for the device 5c is received by a controller, the device 5c is descended by a motor 50 and stood facing to a take-out port P. This operation is detected by a chamfer of the cam, and the ejection is made by pushing a button 51 with an electromagnetic device 60. The disk W is drawn out by the roller 15 and dropped passing through an opening 12c and sent to a sorting mechanism by a roller 16, then, the nondefective goods W are housed in a case 9a at the upper side of a movable bar 8, and the rejected goods W are ejected to a table 9b. Consequently, the qualified goods W only are taken out en bloc and the defective goods W are excluded from a line en bloc, then the numerous disks W are efficiently processed.

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

# 特開平7-153219

技術表示箇所

(43)公開日 平成7年(1995)6月16日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号 庁内整理番号

G11B 23/00

H 7177-5D

5/00

D 7426-5D

20/18

501 C 9074-5D

D 9074-5D

審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全 9 頁)

(21)出願番号

特願平5-329673

(22)出顧日

平成5年(1993)11月30日

(71)出願人 000005968

三菱化学株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

(72)発明者 池田 祥行

神奈川県小田原市成田1060番地 化成パー

ベイタム株式会社小田原工場内

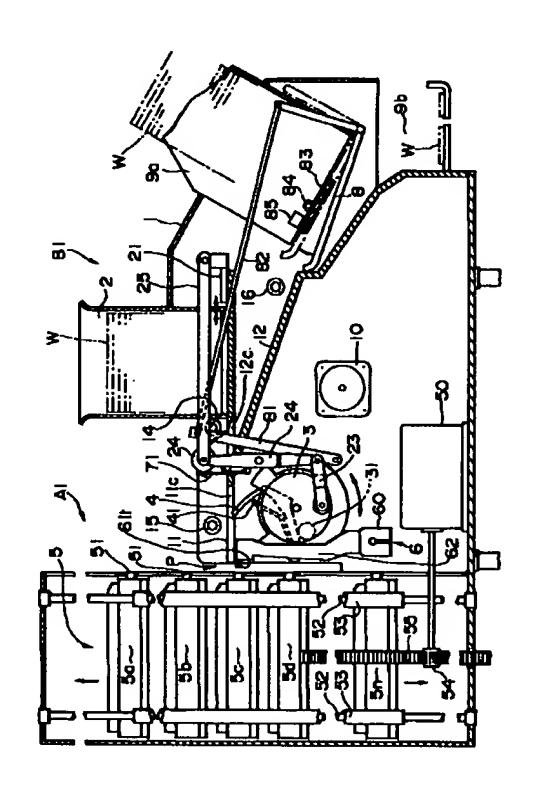
(74)代理人 弁理士 岡田 数彦

# (54) 【発明の名称】 フレキシブルディスクの検査装置

### (57)【要約】

【目的】 フレキシブルディスクのサーティファイを行 う装置であって、多数のフレキシブルディスクを効率的 に処理することが出来る新規なフレキシブルディスクの 検査装置を提供する。

【構成】 検査信号の書き込み及び読み出しを行うディ スク装置(5)を備え且つサーティファイを実行する検 査機構(A1)と、当該検査機構へ検査すべきフレキシ ブルディスク (W) を装填し且つ検査を終えたフレキシ ブルディスク(W)を排出させる装填排出機構(B1) とからなるフレキシブルディスクの検査装置であって、 ディスク装置(5)は、各々独立に作動する複数のディ スク装置(5a)、(5b)…(5n)を並列に配置し て構成される。



1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 フレキシブルディスク(W)に対して検査信号の書き込み及び読み出しを行うディスク装置(5)を備え且つサーティファイを実行する検査機構(A1)と、当該検査機構へ検査すべきフレキシブルディスク(W)を装填し且つ検査を終えたフレキシブルディスク(W)を排出させる装填排出機構(B1)とからなるフレキシブルディスクの検査装置であって、ディスク装置(5)は、各々独立に作動する複数のディスク装置(5a)、(5b)…(5n)を並列に配置して構成 10され、且つ、これらのディスク装置は、その配列方向に移動可能になされていることを特徴とするフレキシブルディスクの検査装置。

【請求項2】 ディスク装置 (5a)、(5b)…(5 n)は、上下方向に積み重ねた状態とされ且つ一体的に 昇降するように構成され、ディスク装置(5)の装填排 出口に対向する走路(11)の端部は、ディスク装置 (5)に対するフレキシブルディスク(W)の供給取出 口(P)とされ、供給取出口(P)と反対側の走路(1 1)の端部には、多数のフレキシブルディスク(W)を 20 収容するホッパー(2)及び押出板(21)が搭載さ れ、ホッパー(2)底部の供給取出口(P)側の側面に は、最下段のディスク(W)を取り出し得る大きさの開 口部が形成され、ホッパー(2)底部の供給取出口 (P)と反対側の側面には、ディスク(W)を押し出す 押出板(21)が出没する開口部が形成され、ホッパー (2)から供給取出口(P)に至る走路(11)には、 フレキシブルディスク (W) をディスク装置 (5) へ挿 入し且つディスク装置(5)から排出させる正逆回転可 能に構成されたローラー(14)、(15)が順次配設 30 され、ローラー(14)を基準として供給取出口(P) 側の走路(11)には、排出させられたディスク(W) が通過する開口部(12c)が設けられ、開口部(12 c)は、当該開口部の位置において走路(11)から分 岐して可動バー(8)へ至るシューター(12)へ通 じ、可動バー(8)は、シューター(12)の下端に連 続的に配設されて落下したディスク(W)をケース(9) a) 又は排出台(9b) へ振り分ける機能を有する請求 項1に記載のフレキシブルディスクの検査装置。

#### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、フレキシブルディスクの検査装置に関するものであり、詳しくは、フレキシブルディスクのサーティファイを行う装置であって、多数のフレキシブルディスクを効率的に処理することが出来る新規なフレキシブルディスクの検査装置に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】一般に、フレキシブルディスクカートリッジ(フレキシブルディスク)は、可撓性支持体の表面 50

2

に磁性層を設けた後、ディスクに形成し、駆動用ハブを 取り付けてケース内に収容するなどして組み立てられ る。そして、電気的、磁気的特性を試験する所謂サーティファイ工程に供給され、各フレキシブルディスク毎に ビット落ち等の有無が確認される。

【0003】従来、上記のサーティファイを行うための検査装置としては、通常、フレキシブルディスクに対して検査信号の書き込み及び読み出しを行うディスク装置を含む検査機構と、当該検査機構へ検査すべきフレキシブルディスクを装填し且つ当該検査機構から検査を終えたフレキシブルディスクを排出させる装填排出機構とを一体的に備えた装置が使用される。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、サーティファイの所要時間は、ディスク装置の書き込み、読み出し時間に依存しており、クリッピングレベルを符号1及び符号0の2つについて設けた場合、ディスク1枚当たりに例えば10~15分程度を要するが、従来の検査装置においては、ディスクを1枚毎に処理するために処理効率が極めて低く、そのため、フレキシブルディスクの量産工程では、多数の検査装置を配置することにより対処しているのが現状である。従って、設備コスト及び設備の専有面積が低減できないという問題がある。

【0005】本発明は、上記の実情に鑑みなされたものであり、その目的は、フレキシブルディスクのサーティファイを行う装置であって、多数のフレキシブルディスクを効率的に処理することが出来る新規なフレキシブルディスクの検査装置を提供することにある。

#### [0006]

30 【課題を解決するための手段】すなわち、本発明の要旨は、フレキシブルディスク(W)に対して検査信号の書き込み及び読み出しを行うディスク装置(5)を備え且つサーティファイを実行する検査機構(A1)と、当該検査機構へ検査すべきフレキシブルディスク(W)を装填し且つ検査を終えたフレキシブルディスク(W)を排出させる装填排出機構(B1)とからなるフレキシブルディスクの検査装置であって、ディスク装置(5)は、各々独立に作動する複数のディスク装置(5a)、(5b)…(5n)を並列に配置して構成され、且つ、これらのディスク装置は、その配列方向に移動可能になされていることを特徴とするフレキシブルディスクの検査装置に存する。

### [0007]

【作用】検査機構(A1)において、各々独立に作動する複数のディスク装置(5a)、(5b)…(5n)を並列に配置して構成され、且つ、これらのディスク装置をその配列方向に移動可能になされたディスク装置(5)は、装填排出機構(B1)の稼働率を高め、フレキシブルディスク(W)の連続的な処理を可能にする。【0008】

19 4 July

【実施例】本発明の実施例を添付図面に基づいて説明す る。図1は本発明のフレキシブルディスクの検査装置の 一実施例を示す平面図、図2は図1に示されるフレキシ ブルディスクの検査装置の側面図、図3~図8は本発明 のフレキシブルディスクの検査装置の作動を示す要部側 面図である。なお、本実施例においてフレキシブルディ スクの検査装置を検査装置と、フレキシブルディスクを ディスクと略記する。

【0009】本発明の検査装置は、図1に示す様に、デ ィスク(W)に対して検査信号の書き込み及び読み出し 10 を行うディスク装置(5)を備え且つサーティファイを 実行する検査機構(A1)と、当該検査機構へ検査すべ きディスク(W)を装填し且つ検査を終えたディスク (W)を排出させる装填排出機構(B1)とからなり、 そして、図2に示す様に、ディスク装置(5)は、各々 独立に作動する複数のディスク装置(5a)、(5b) …(5n)を並列に配置して構成され、且つ、これらの ディスク装置は、その配列方向に移動可能になされてい る。

【0010】本発明の検査装置において、検査機構(A 20 1)及び装填排出機構(B1)は、平面形状が略長方形 の箱状のフレーム(1)に設けられる。検査機構(A 1)は、図1に示されるフレーム(1)の一端側に設け られ、ディスク装置(5)、および、当該ディスク装置 に装填されたディスク(W)にサーティファイを行うた めの検査回路(図示せず)を備えている。

【0011】ディスク装置(5)は、磁気ヘッド及びド ライブ機構を有し、ディスクに信号の書き込み及び読み 出しを行う通常の所謂フレキシブルディスク装置であ り、ディスクの装填排出口をフレーム(1)の他端側に 30 れている。そして、ホッパー(2)底部の供給取出口 向けて水平に配置される。ディスク装置(5)は、装填 されたディスクを排出するためのイジェクトボタン (5 1)が例えば装填排出口の下方に付設されている。ま た、上記の検査回路は、適宜の検査プログラムが書込み 可能な記憶手段を含む。

【0012】本発明においては、図2に示す様に、ディ スク装置(5)として複数のディスク装置(5a)、 (5b)…(5n)を使用することにより、多数枚のデ ィスク(W)の効率的な処理を可能にする。ディスク装 置(5a)、(5b)…(5n)の並列的な配置として 40 は各種の態様が挙げられるが、例えば、ディスク装置 (5a)、(5b)…(5n)は、占有面積を最小限に するため、同一ピッチで構成された棚部材に搭載され、 上下方向に積み重ねた状態とされる。

【0013】上記の棚部材は、その外周に管状の支持フ レーム(53)、(53)を備え、これらの支持フレー ム(53)には、フレーム(1)の一端側に立設された 案内支柱(52)、(52)が挿通される。また、棚部 材の側面にはラック(55)が付設されており、斯かる ラック(55)には、正逆回転可能なサーボモーター

(50)のスピンドル先端に取り付けられたピニオン (54)が噛合している。そして、サーボモーター(5 O)の駆動によって、ディスク装置(5a)、(5b) … (5 n)が一体的に昇降するように構成されている。 【0014】装填排出機構(B1)においては、図1、 図2に示す様に、フレーム(1)の上部に当該フレーム の略中央から検査機構(A1)に向けて走路(11)が 架設されており、そして、ディスク装置 (5) の装填排 出口に対向する走路(11)の端部は、ディスク装置 (5)に対するディスク(W)の供給取出口(P)とさ れている。

【0015】装填排出機構(B1)は、検査すべきディ スク(W)をディスク装置(5)へ供給する手段と、検 査を終えたディスク(W)をディスク装置(5)から排 出させる手段と、排出したディスク(W)を検査結果に 基づき合格品と不合格品とに振り分ける手段とを備えて いる。以下、これら供給手段、排出手段および振り分け 手段の具体的な構成を説明する。

【0016】上記の供給手段は、検査すべき多数のディ スク(W)を収容するホッパー(2)、当該ホッパーか らディスク装置(5)へ向けてディスク(W)を送り出 す押出板(21)及びローラー(14)、(15)、デ ィスク(W)をディスク装置(5)へ押し込むアーム (4)から主として構成される。

【0017】ホッパー(2)は、供給取出口(P)と反 対側の走路(11)の端部に搭載される。斯かるホッパ ー(2)は略四角筒状に形成されており、その底部の供 給取出口(P)側の側面には、最下段に位置する1枚の ディスク(W)を取り出し得る大きさの開口部が形成さ (P)と反対側の側面には、ディスク(W)を押し出す ための押出板(21)が出没する開口部が形成されてい る。

【0018】押出板(21)は、ディスク(W)よりも 僅かに薄い厚みに形成され、供給取出口(P)と反対側 の走路(11)の端部に水平に搭載されている。斯かる 押出板(21)は、その両側縁側に枢着された直動リン ク(25)、(25b)を含むカム機構によって作動す るようになっている。

【0019】上記のカム機構は、フレーム(1)の側面 に配置された円盤状のカムドライバ(3)、カムドライ バ(3)の外周側に枢着されたカムフォロアー(2 3)、カムドライバ(3)近傍のフレーム(1)の側面 に中央部が枢支され且つ略垂直方向に伸長配置されて下 端にカムフォロアー(23)が枢着された固定リンク (24)、および、固定リンク(24)の上端に枢着さ れて走路(11)と略平行に配置された上記一方の直動 リンク(25)にて構成される。また、固定リンク(2 4)と反対側のフレーム(1)の側面には、固定リンク 50 (24)と同軸に且つ支点間の長さが固定リンク(2

4)に等しい他の固定リンク(24b)が設けられ、斯 かる固定リンク(24b)の上端には、他方の直動リン ク(25b)がホッパー(2)を介して直動リンク(2 5)と平行に枢着される。

【0020】カムドライバ(3)は、走路(11)の下 方に配置された正逆回転可能なサーボモーター(30) のスピンドルに取り付けられ、そして、サーボモーター (30)の駆動により、カムフォロアー(23)を介し て固定リンク(24)、(24b)を揺動させ、直動リ ンク(25)、(25b)を走路(11)に沿って進退 10 させるようになっている。また、カムドライバ(3)の 外周には、適宜に切り欠かれた鍔が形成されており、斯 かる鍔をセンサー(図示せず)を用いて検出することに より、カムドライバ(3)、ローラー(14)、(1 **5)、(16)等の作動を制御し且つ同期させるように** 構成されている。

【0021】ローラー(14)、(15)は、ホッパー (2)から供給取出口(P)に至る走路(11)に沿っ て順次配設され、且つ、走路(11)の表面からディス ク(W)の厚みに相当する距離だけ離間させられてい る。これらのローラー(14)、(15)は、各一端部 に取り付けられたプーリー(14p)、(15p)及び これらのプーリーに巻回されたベルト(10g)を介 し、正逆回転可能なサーボモーター(10)により、後 述する排出手段のローラー(16)と共に回転するよう に構成される。斯かるローラー(14)、(15)は、 フレキシブルディスク(W)をディスク装置(5)へ挿 入する機能し、且つ、後述する様に、ディスク装置 (5)から排出させる機能を有する。

【0022】アーム(4)は、略ハンマー状に形成さ れ、ディスク装置(5)側へ湾曲した状態で走路(1 1)の下方に当該走路の中心線に沿って配置される。ア ーム(4)は、その基端部が供給取出口(P)の下方で 且つ上記のカムドライバ(3)の軸線と平行にフレーム (1)側に枢支された水平軸に取り付けられている。そ して、アーム(4)は、その頭部先端を上方に向けて傾 転した位置から直立した位置の範囲内で回動自在になさ れており、且つ、通常は弾性部材(図示せず)によって 傾転した状態に保持されている。また、アーム (4)の され、その先端には、当該アームの湾曲形状に倣って幾 分折曲されたレバー (41) が設けられている。

【0023】一方、カムドライバ(3)背面の外周に は、カムフォロアー(23)の枢着位置よりも通常の回 **転方向の後方側に40~80°程位相をずらしてクラン** クピン(31)が突設されており、カムドライバ(3) の回転に伴って適宜の位置で上記のレバー(41)を押 し上げ、そして、アーム(4)をディスク装置(5)側 へ回動させるようになっている。また、走路(11)の 供給取出口(P)近傍には、アーム(4)の頭部が出没 50 掛かるように構成されている。

する開口(11c)が形成されている。

【0024】上記の排出手段は、ディスク装置(5)の イジェクトボタン(51)を操作するイジェクトイジェ クトアーム(6)、ディスク装置(5)から上記の振り 分け手段へ向けてディスク(W)を移送するローラー (15)、(16)及び偏向板(7)から主として構成 される。

【0025】イジェクトイジェクトアーム(6)は、フ レーム(1)の両側面に外方から枢着された直立する一 対のアーム部材(62)と、これらアーム部材(62) の上端に架設された水平なステー(61)とから形成さ れ、供給取出口(P)の下方に配置される。また、ステ ー(61)のディスク装置(5)側に縁部には、供給取 出口(P)に位置するディスク装置(5)のイジェクト ボタン(51)に対峙するように突起(61t)が設け られている。

【0026】イジェクトイジェクトアーム(6)は、通 常、突起(61t)がイジェクトボタン(51)から離 間する方向に弾性部材(図示せず)にて付勢されてお り、そして、ディスク (W) をディスク (5) から取り 出す際、一方のアーム部材(62)の基端部に付設され た電磁装置によってディスク装置(5)側へ回動するよ うに構成されている。なお、図示しないが、供給取出口 (P)下方のステー(61)が位置するフレーム(1) の縁部は、ステー(61)が前後に揺動し得る程度に切 欠かれている。

【0027】また、ローラー(14)を基準として供給 取出口(P)側の走路(11)には、排出させられたデ ィスク(W)が通過し得る程度の開口部(12c)が設 30 けられる。斯かる開口部(12c)は、当該開口部の位 置において走路(11)から分岐し、ホッパー(2)の 下方を通過して上記の振り分け手段へ至るシューター (12)へ通じている。そして、偏向板(7)は、開口 部(12c)の上方に配置される。

【0028】偏向板(7)は、略帯状の薄板であってフ レーム(1)の幅方向に亘って架設され、且つ、その長 手方向の一方の縁部に設けられた軸がフレーム(1)側 に回動自在に枢支されて他方の縁部が揺動自在に懸下さ れている。偏向板(7)の回動軸の一端は、カムドライ 水平軸の一端は、カムドライバ(3)の背面側まで伸長 40 バ(3)側のフレーム(1)の側面に突出させられて検 査機構(A1)側へ折曲され、そして、先端にウェイト (71)が揺動自在に取り付けられる。

> 【0029】ウェイト(71)は略矩形の板状体に形成 され、且つ、図4又は図8に示す様に、その長手方向に 沿って盤面上に開口された長穴を、フレーム(1)の側 面に突設されたピンによって係止されて昇降自在になさ れる。また、ウェイト(71)の上端は、当該ウェイト が昇降した際に不要な回動を防止するため、フレーム (1)の内側へ折曲されてフレーム(1)の上縁に引っ

【0030】偏向板(7)は、通常、その下端がウェイ ト(71)の自重によってホッパー(2)側へ近接する 角度に保持されている。そして、斯かる偏向板(7) は、ホッパー(2)からディスク(W)が押し出された 際、その下端がホッパー(2)から離間する方向に回動 して当該フレキシブルディスクを通過させ、また、ディ スク装置(5)からディスク(W)が排出された際、当 該フレキシブルディスクの移動方向をシューター(1 2) 側へ偏向するようになっている。

【0031】また、図1、図2に示す様に、ローラー (15)、(16)は、排出時には上述した機構によっ て装填時とは逆方向に回転し、ディスク装置(5)から 一部排出されたディスク(W)を更に引き出してシュー ター(12)へ落下させ、そして、振り分け手段へ送り 込む機能を有する。

【0032】上記の振り分け手段は、可動バー(8)、 合格品のディスクを収容するケース(9a)、不合格品 のディスクを搭載する排出台(9b)とから主として構 成され、移送されたディスク(W)の振り分けは、可動 バー(8)の作用によって行われる。

【0033】可動バー(8)は、排出されたディスク (W)をケース(9a)又は排出台(9b)へ実質的に 振り分ける機能を有し、シューター(12)の下端に連 続的に配設される。具体的には、可動バー(8)は、側 面形状において略逆し字状に形成され且つ平面形状にお いてディスク(W)よりも幾分狭い幅に配置された2本 の棒状体を有する枠部材にて構成される。可動バー

(8)の上端部は、リンク(82)を介し、揺動リンク (81)に接続される。揺動リンク(81)は、上記カ 着部分に同軸に付設された短軸円筒状のドグ(24)に よって適宜に押圧され、そして、可動バー(8)を回動 させるように構成されている。

【0034】ケース(9a)は、合格品として振り分け られたディスク (W)を積層した状態で収容するもので ある。斯かるケース(9a)は、通常、上面および底面 が開放され且つ水平断面をホッパー(2)側が開放され た略コ字状の樋状体とされ、そして、ディスク(W)を 整列状態で収容するため、ホッパー(2)から離間する られる。

【0035】また、ケース(9a)の底部には、収容さ れたディスク(W)を保持するための一対の支持板(8 3) が備えられる。支持板(83) は、ケース(9a) の開口底面に略沿ってフレーム(1)の両側壁から進退 自在に突設され、且つ、両側壁との間に各々介装された 弾性部材(84)によってケース(9a)の底面に常時 突出した状態とされる。そして、フレーム(1)の両側 壁には、電磁装置(85)、(85)が備えられ、これ 品のディスク(W)を収容する際、一時的に支持板(8) 3)を後退させるように機能する。

8

【0036】一方、排出台(9b)は、ケース(9a) に収容されなかった不合格ディスクを搭載するための支 | 持枠であり、可動バー(8)の下方に配置されている。 なお、図示しないが、本発明の検査装置には、記憶およ び演算手段を含み、検査の進行に応じて当該検査装置の 作動を制御する制御回路が検査機構(A1)の検査回路 と一体的に又は別個に設けられる。

10 【0037】以下、本発明の検査装置における作動を説 明する。

【0038】 〔ディスク (W) の装填〕 先ず、 検査すべ き適宜の枚数のディスク(W)をホッパー(2)へ収容 する。図3に示される状態は、検査機構(A1)に対 し、ディスク(W)の供給を開始する直前の初期状態で あり、図3の様に側面視した場合、カムドライバ(3) に対するカムフォロアー(23)の枢着部、すなわち、 カムフォロアー(23)の基部(23e)は略真下に位 置し、押出板(21)はホッパー(2)の外方に位置し 20 ている。

【0039】検査装置を作動させると、図4に示す様 に、カムドライバ(3)は当該図面上で反時計方向に回 転し、そして、カムフォロアー(23)の基部(23 e)が6時の位置から3時の位置に至るに従い、押出板 (21)がホッパー(2)の内部に突入する。これによ り、積層されたディスク(W)の中、最下段に位置する ディスク(W)を走路(11)上へ送り出すことが出来 る。

【0040】また、押出板(21)の作動と同時に、各 ム機構の固定リンク(24)と直動リンク(25)の枢 30 ローラー(14)、(15)は時計方向に回転し、ホッ パー(2)から幾分押し出されたディスク(W)をロー ラー(14)によって完全に引出すことが出来る。その 場合、ローラー(14)に対して検査機構(A1)側に 配置された偏向板(7)は、ディスク(W)の移動によ ってその移動方向に回動し、ディスク(W)の妨げとな ることは無い。

【0041】ディスク (W) は、ローラー (14) から 供給取出口(P)の近傍のローラー(15)に移送され た後、図5に示す様に、ローラー(15)により、ディ 方向に幾分傾斜させられて可動バー(8)の上方に設け 40 スク装置(5)の中の例えばディスク装置(5 c)にそ の先端が挿入される。また、この間、カムドライバ (3)は、カムフォロアー(23)の基部(23e)が 3時の位置から12時の位置に至るまで更に回転し、押 出板(21)はホッパー(2)外方の初期位置へ後退す る。

【0042】引続き、図6に示す様に、カムドライバ (3)は、カムフォロアー(23)の基部(23e)が 12時の位置から9時の位置に至るまで回転する。その 際、カムドライバ(3)の裏側に突設されたピン(3) らの電磁装置(85)は、可動バー(8)によって合格 50 1)は、レバー(41)を背面から押し上げ、アーム

(4)をディスク装置(5c)側へ回転させる。これに より、ディスク装置(5c)へ一部挿入されたディスク (W)を完全に当該ディスク装置内に装填することが出 来る。

【0043】上記の様に、例えば、ディスク装置(5 c)へ1枚のディスク(W)が装填されると、カムドラ イバ(3)は、更に、カムフォロアー(23)の基部 (23e)が9時の位置から6時の位置に至る方向に回 転する。その際、図2に示す様に、ディスク(5)は、 複数のディスク装置(5a)、(5b)…(5n)を積 10 み重ねた状態に配置して構成されており、サーボモータ ー(50)の駆動により、例えば、ディスク装置1台分 だけ上昇し、ディスク装置(5c)の下方に配置された ディスク装置(5d)が供給取出口(P)に対峙する。 そして、ディスク装置(5c)と同様に、次のディスク (W) が装填される。更に、他のディスク装置 (5 d) …(5n)へも順次装填される。

【0044】〔ディスク(W)の検査〕一方、ディスク 装置(5)は、各々独立に作動する複数のディスク装置 (5a)、(5b)…(5n)を並列に配置して構成さ 20 れており、先に装填を終えたディスク装置(5c)は、 装填とともにディスク(W)の検査を実行する。本発明 の検査装置においては、概略、次のステップによってサ ーティファイを行う。

【0045】先ず、ディスク(W)へ試験信号を書き込 んだ後、書き込まれた試験信号を読みだしてドロップア ウト試験を行う。すなわち、平均信号振幅と読み出し時 の個々のパルス出力振幅とを比較し、その個々の出力振 幅が所定の基準に満たない所謂ミッシングパルス(信号 誤り)を検出する。

【0046】次に、ディスク(W)に書き込まれた試験 信号を所定の直流磁界を加えて消去した後、残存する試 験信号を再び読み出してドロップイン試験を行う。すな わち、消去前の平均信号振幅と読み出し時の残存する試 験信号とを比較し、読み出し時の出力振幅が所定の基準 を超える所謂エキストラパルス(信号誤り)を検出す る。

【0047】そして、上記の各試験によって信号誤りが 検出された場合、ビット情報としてディスク(W)上へ 書き込むと共に、信号誤りが所定の基準よりも少ないも 40 のを合格ディスクとし、多いものを不合格ディスクとす る。なお、上記のサーティファイは、アナログ的な方式 であるが、破束反転間隔のウィンドウ幅を適宜に設定し て上記の各試験をデジタル的に行うことも出来る。上記 のような方法によって、各ディスク装置(5a)、(5 b)…(5n)は、ディスク(W)の装填直後、個々に サーティファイを実行してゆく。

【0048】〔ディスク(W)の排出〕装填排出機構 (B1)によって各ディスク装置(5a)、(5b)… スク装置は独立して順次検査を実行するが、例えば、制 御装置(図示せず)がディスク(W)を先に装填したデ ィスク装置(5c)から検査終了の情報信号を受けた場 合、他のディスク装置(5d)…(5n)の検査の実行 状況に拘らず、サーボモーター(50)の駆動によって ディスク装置(5)が下降し、そして、ディスク装置 (5c)は再び供給取出口(P)に対峙する。一方、デ ィスク装置(5)が下降する際、図1中に示すサーボモ ーター(30)が逆転してカムドライバ(3)は時計方

10

【0049】次いで、図7に示す様に、一旦、カムフォ ロアー(23)の基部(23e)が9時の位置まで逆転 した後、カムドライバ(3)は、再びカムフォロアー (23) の基部(23e) が6時の位置に達するまで回 転する。 斯かるカムドライバ (3) の作動は、 当該カム ドライバの切り欠かれた鍔を介して検出され、そして、 その情報信号によってイジェクトアーム(6)の基部に 設けられた電磁装置(60)が作動する。すなわち、電 磁装置(60)は、イジェクトアーム(6)を一瞬ディ スク装置(5)側へ傾転させ、当該アーム先端に付設さ れた突起(61t)は供給取出口(P)に対峙するディ スク装置(5c)のイジェクトボタン(51)を押圧す る。その結果、ディスク装置(5 c)に装填されていた ディスク(W)の一部を当該ディスク装置内から排出さ せることが出来る。

【0050】更に、上記のカムドライバ(3)の作動に 伴い、各ローラー(15)、(16)は、装填時とは反 対に、図7中において反時計方向に回転しており、ディ 30 スク装置 (5 c) から一部排出されたディスク (W) は、ローラー(15)によって完全に引き出され、走路 (11)上をホッパー(2)の方向へ移送される。 【0051】次いで、図8に示す様に、ディスク装置 (5c) から引き出されたディスク (W) は、ローラー (14)よりもディスク装置(5)側の走路(11)の 上方に懸下された偏向板(7)に接触し、開口部(12 c)に没入する。そして、開口部(12c)を通過した ディスク (W) は、シューター (12) を落下させら れ、ローラー(16)を介して図2に示される振り分け 機構に供給される。

【0052】[ディスク(W)の振り分け]検査機構 (A1)において、上記の排出されたディスク (W)の ビット落ち等の欠陥が所定の範囲内であり、合格ディス クであると判別された場合、斯かるディスク (W)は、 可動バー(8)の上に搭載される。すなわち、図2に示 す様に、可動バー(8)は、シューター(12)の略延 長上に位置して、シューター(12)に落下したディス ク(W)を受け止める。

【0053】ディスク(W)が可動バー(8)に搭載さ (5n)にディスク(W)を装填した後、これらのディ 50 れた後、ケース(9a)の底部に配置された電磁装置

向に回転し、カムフォロアー(23)の基部(23e) が6時の位置から9時の位置に至る。

(85)が作動し、支持板(83)、(83)を後退さ せる。支持板(83)の後退により、ケース(9a)内 に、例えば、先に検査済の他のディスク(W)が収容さ れている場合、ケース(9a)内のディスク(W)は、 可動バー(8)上に排出されたディスク(W)の上へ落 下して積み重ねられる。

【0054】次いで、図7中に示す様に、カムドライバ (3)は、カムフォロアー(23)の基部(23e)が 6時から9時の位置に達するまで逆転し、そして、固定 リンク(24)の上端がホッパー(2)側へ幾分傾転し 10 てドグ(24)が揺動リンク(81)を押圧する。揺動 リンク(81)は、リンク(82)を介して可動バー (8)を図2中の仮想線に示す位置まで回動させ、当該 可動バー上に一旦積み重ねられたディスク(W)を上方 へ持ち上げる。

【0055】可動バー(8)が上方へ回動した状態にお いて、上記の電磁装置(85)の作動が解除され、後退 していた双方の支持板(83)は再びケース(9a)の 底部へ突出する。これにより、その後、カムフォロアー (23)の基部(23e)が9時から6時の位置に至る 20 ようにカムドライバ(3)が回転して可動バー(8)が 再びシューター(12)の延長上に位置した際、振り分 けたディスク (W)を含む多数のディスク (W)をケー ス(9a)の内部に保持することが出来る。

【0056】ところで、検査機構(A1)において、排 出されたディスク(W)が不合格ディスクであると判別 された場合、カムドライバ(3)は、図7に示されるイ ジェクトアーム(6)の作動位置から僅かに反時計方向 に回転した位置、すなわち、カムフォロアー(23)の ンク(24)の上端をホッパー(2)側へ傾転させた状 態を保持する。その際、可動バー(8)は、図2の仮想 **線に示される様に上方へ回動しているため、排出されて** シューター(12)を落下したディスク(W)は可動バ ー(8)の下方を通過して排出台(9b)に搭載され る。その後、カムドライバ(3)は、カムフォロアー (23)の基部(23e)が6時の位置まで回転し、図 3に示す初期状態に復帰する。

【0057】上記のように、合格品と判別されたディス ク(W)は可動バー(8)上方のケース(9a)内に収 40 容され、不合格品と判別されたディスク(W)は排出台 (9b)へ排出される。従って、ケース(9a)から は、合格品のディスク(W)のみを一括して取り出すこ とが出来、また、排出台(9b)上の不合格品のディス ク(W)を一括して製造ラインから除外することが出来 る。

【0058】ところで、本発明の検査装置の上述の作動 は、一のディスク(W)をディスク装置(5c)に装填 した場合を例示して説明したものであり、検査機構(A 1)においては、各ディスク装置(5a)、(5b)… 50 m

(5 n)は独立して順次作動するため、検査装置におい て、例えば、上方のディスク装置 (5a) から順に下方

のディスク装置(5n)に装填した場合には、通常はデ ィスク(W)を装填した順に検査が実行されて順次に排

12

出される。

【0059】上記のように、本発明の検査装置は、検査 機構(A1)において、各々独立に作動する複数のディ スク装置(5a)、(5b)…(5n)を並列に配置し てディスク装置(5)を構成し、且つ、これらのディス ク装置をその配列方向に移動可能としたため、装填排出 機構(B1)の稼働率を十分に高めることが出来、ディ スク(W)の連続的な処理を可能にする。すなわち、本 発明の検査装置においては、ディスク(W)を連続的に 供給して逐次検査を行うため、検査中の待機時間を低減 させることが出来、高い処理効率を得ることが出来る。 従って、設備コスト及び設備の専有面積も低減すること が出来る。

【0060】なお、上記の実施例を示す各図において は、90㎜のフレキシブルディスクを一例として示した が、本発明の検査装置は、ケースにディスクを内蔵して 情報を磁気的に記録保持する130㎜、200㎜等の各 種規格の可撓形記録媒体にも同様に適用し得る。

【0061】また、上記の実施例において、ディスク装 置(5)は、複数のディスク装置(5a)、(5b)… (5 n)を上下に積み重ねた状態に配置したものである が、本発明の検査装置においては、複数のディスク装置 を水平方向に並列配置してそれらをスライド可能に構成 したり、または、軸線が垂直な回転テーブル上に放射状 に配置することも可能であり、その場合も上記の実施例 基部(23e)が略8時の位置において停止し、固定リ 30 と同様に、多数のディスクを効率的に処理することが出 来る。

[0062]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 フレキシブルディスクのサーティファイを行う場合、デ ィスク装置に対してフレキシブルディスクを連続的に供 給して逐次検査を行うため、多数のフレキシブルディス クを効率的に処理することが出来る。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のフレキシブルディスクの検査装置の一 実施例を示す平面図である。

【図2】図1に示されるフレキシブルディスクの検査装 置の側面図である。

【図3】本発明のフレキシブルディスクの検査装置の作 動を示す要部側面図である。

【図4】本発明のフレキシブルディスクの検査装置の作 動を示す要部側面図である。

【図5】本発明のフレキシブルディスクの検査装置の作 動を示す要部側面図である。

【図6】本発明のフレキシブルディスクの検査装置の作 動を示す要部側面図である。

【図7】本発明のフレキシブルディスクの検査装置の作動を示す要部側面図である。

【図8】本発明のフレキシブルディスクの検査装置の作動を示す要部側面図である。

# 【符号の説明】

1:フレーム

11:走路

12:シューター

12c:開口部

14、15、16:ローラー

2:ホッパー

21:押出板

5:ディスク装置

5a、5b、5c、5n:ディスク装置

14

8:可動バー

9a:ケース

9 b:排出台

A1:検査機構

B1:装填排出機構

P:供給取出口

10 W: フレキシブルディスク

# 【図1】

